

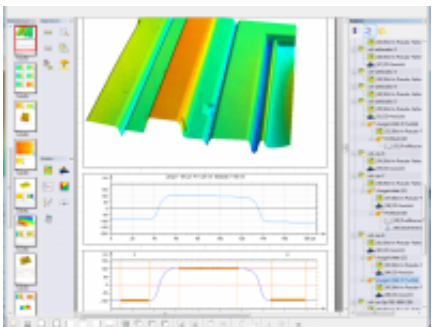
## Mikroskope



Mess- und Inspektionsmikroskope in verschiedener Ausstattung für Halbleiter / MEMS Applikationen. Höchste optische Leistungsfähigkeit, schnelle einfache Bedienung.

[Mehr Informationen](#)

## Software MCS



Modulare Softwaresuite MCS:

- Inspektion
- Review
- Metrology (CD, Konfokal,...)
- Hardwaresteuerung

[Mehr Informationen](#)

## Inspection&Metrology



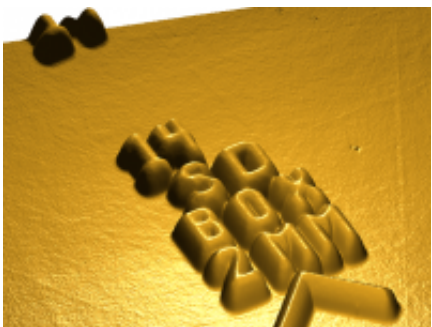
## **PROMIS**

Promicron Inspektions & Metrologie Systeme

- vollautomatisch
- flexibel nutzbar
- für Inspektion und Metrologie

[Mehr Informationen](#)

## **Weisslichtinterferenz**

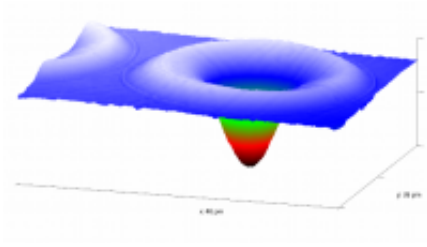


## **PRO-WLI**

Mikroskopausrüstung auf Basis INM200/Ergoplan oder DM8000 mit Interferometer-Hardware & Software zur Vermessung der Topographie sowie zum Export der 3D Daten.

[Mehr Informationen](#)

## Konfokal Mikroskopie



### **PRO-CON**

Mikroskop-Konfokalm modul als Upgrade für hochauflösende 3D Metrology.

[Mehr Informationen](#)

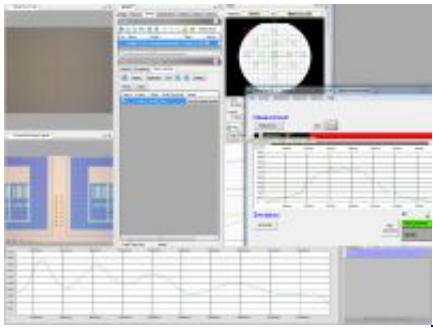
## Leica DM8000



Inspektionsmikroskop Leica DM8000 MCS. Modifiziertes Mikroskop für VIS und IR Inspektion im Auflicht und Durchlicht. Software zur halbautomatischen Wafer & MEMS Inspektion.

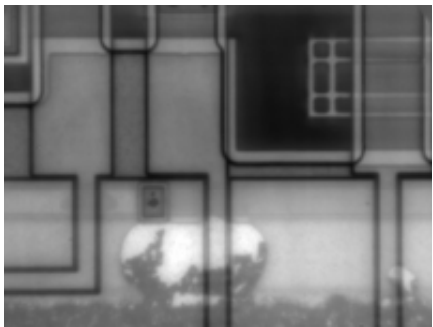
[Mehr Informationen](#)

## Thin Film Measuring



[Mehr Informationen](#)

## **Infrared Systems**



[Mehr Informationen](#)